

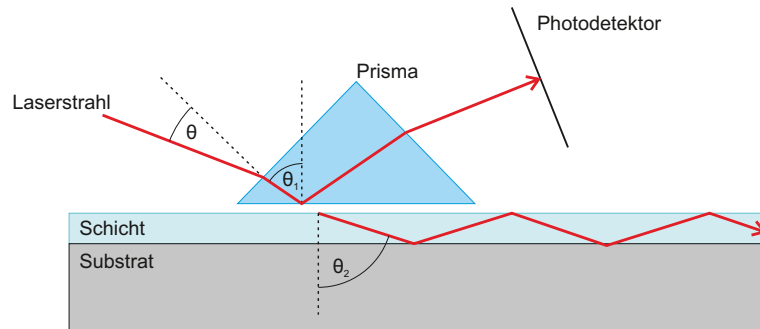
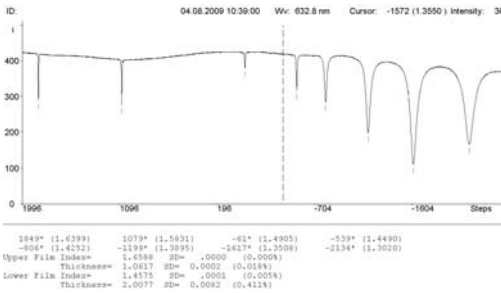
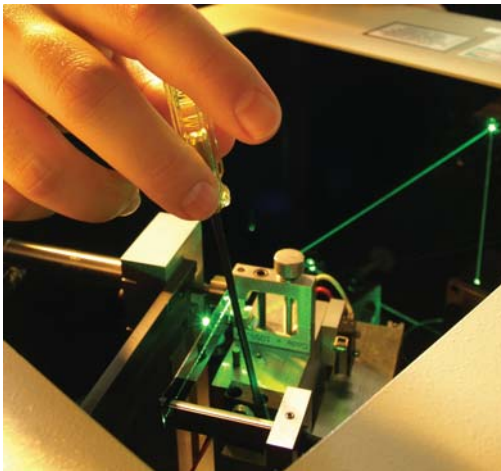


## PRISMENKOPPLER

METRICON 2010

### CHARAKTERISIERUNG VON OPTISCHEN DÜNNEN SCHICHTEN

- Brechungsindexmessung an Bulkmaterialien, Einzel- und Doppelschichten
- Schichtdickenmessung bei dünnen Einzel- und Doppelschichten
- Dämpfungsmessungen von optischen Dünnschichten auf dielektrischen Materialien



### MESSPARAMETER

- Wellenlängen (TE oder TM):  
405, 473, 532, 633, 790, 1320 und 1550 nm
- Messbereiche und Genauigkeit:
 

Brechungsindex:	1.0 - 2.45	± 0.005
Schichtdicke:	0.5 - 150 μm	± 0.5%
Dämpfung:	0.1 - 15 dB/cm	± 5%
- Probengrösse  
 maximal: 200 x 200 mm<sup>2</sup>  
 minimal: 5 x 5 mm<sup>2</sup>  
 für Dämpfungsmessung mindestens: 5 x 50 mm<sup>2</sup>

